



1. *Info value
2. Situation of working surface $\pm 20\text{nm}$
3. Protective chamfers: 0.1mm – 0.2mm
4. Defects outside the controlling area are not defined

		FS.00.236			Massstab 1:1	Werkstoff
					Fused silica	
			Datum	Name	ANO-Q-P1000-R1.95	
		Bearb.	09.02.09			
		Gepr.				
		Norm				
		[ams] advanced microptic systems gmbh			Blatt	
Zust	Anderung	Datum	Name	(Urspr.)	(Ers. f.)	(Ers. d.)
						Bl.